# GLASS COMPOSITION FOR MAGNETIC DISK SUBSTRATE AND MAGNETIC DISK SUBSTRATE

Publication number: JP10226532 (A)

Publication date: 1998-08-25

Inventor(s): TAGUCHI TOMOYUKI; KAWAI HIDEKI; OBARA TORU; KURIYAMA IKUO;

WAKABAYASHI HAJIME

Applicant(s): YAMAMURA GLASS CO LTD

Classification:

- international: C03C21/00; C03C3/097; C03C10/12; G11B5/66; G11B5/73; G11B5/84; C03C21/00;

C03C3/076; C03C10/00; G11B5/62; G11B5/66; G11B5/84; (IPC1-7): C03C3/097;

C03C10/12; C03C21/00; G11B5/66; G11B5/84

- European:

Application number: JP19960357203 19961226

Priority number(s): JP19960357203 19961226; JP19950353194 19951228; JP19960346787 19961210

#### Abstract of JP 10226532 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a glass composition for magnetic disk substrate and a magnetic disk substrate capable of easily molding, easily grinding after the crystallization by heating and chemically strengthening by ion exchange after molding and grinding and excellent in chemical durability, mechanical strength, heat resistance, surface smoothness, surface flatness and small in the deterioration of magnetic film property. SOLUTION: The glass composition for magnetic disk substrate has a composition of by wt.%, 66-80 SiO2 , 5-15 Al2 O3 , 3-8.5 Li2 O, 0-3 Na2 O, 0-3 K2 O, 0.5-8 TiO2 , 3.5-8 ZrO2 , 0.5-3 P2 O5 , 0-2 Sb2 O3 and 0-2 Sb2 O3 as oxides and has a theoretical optical basicity of <=0.548. The magnetic disk substrate is strengthened by ion-exchanging after molding and grinding the composition. A main crystal phase formed by molding, heat-treating and grinding the composition in the magnetic disk substrate is Li2 O.2SiO2 or spodumene.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平10-226532

(43)公開日 平成10年(1998) 8月25日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I
C 0 3 C 3/097		C 0 3 C 3/097
10/12		10/12
21/00	101	21/00 1 0 1
G11B 5/66		G 1 1 B 5/66
5/84		5/84 Z
		審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 18 頁)
(21)出願番号	特顯平8-357203	(71)出願人 000178826
		山村硝子株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)12月26日	兵庫県西宮市浜松原町2番21号
		(72)発明者 田口 智之
(31)優先権主張番号	特願平7-353194	兵庫県西宮市浜松原町2番21号 山村硝子
(32)優先日	平7 (1995)12月28日	株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 河合 秀樹
(31)優先権主張番号	特願平8-346787	兵庫県西宮市浜松原町2番21号 山村硝子
(32)優先日	平8 (1996)12月10日	株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 小原 融
		兵庫県西宮市浜松原町2番21号 山村硝子
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 内山 充
		最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 磁気ディスク基板用ガラス組成物及び磁気ディスク基板

#### (57)【要約】

【課題】成形が容易で、熱処理による結晶化後、容易に研磨加工ができ、あるいは成形、研磨後、イオン交換により化学強化でき、優れた化学的耐久性、機械的強度、耐熱性、表面平滑性、表面平坦性を有し、磁気膜特性の劣化の少ない磁気ディスク基板用ガラス組成物及び磁気ディスク基板を提供する。

【解決手段】SiO<sub>2</sub>:66~80重量%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:5~15重量%、Li<sub>2</sub>O:3~8.5重量%、Na<sub>2</sub>O:0~3重量%、K<sub>2</sub>O:0~3重量%、TiO<sub>2</sub>:0.5~8重量%、ZrO<sub>2</sub>:3.5~8重量%、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.5~3重量%、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~2重量%、As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~2重量%の組成を有し、理論的光学的塩基性度が0.548以下である磁気ディスク基板用ガラス組成物、並びに、該組成物を成形、研磨後、イオン交換し、強化した磁気ディスク基板、及び、該組成物を成形、熱処理、研磨して作製された主結晶相がLi<sub>2</sub>O・2SiO<sub>2</sub>及び/又はスポジュメンである磁気ディスク基板。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】酸化物として、

S i O<sub>2</sub> :66~80重量% A1,0, :5~15重量% LizO :3~8.5重量% Na,O : 0~3重量% :0~3重量% K,O

但し、Li,O+Na,O+K,O:3~10重量%

:0.5~8重量% TiO, :3.5~8重量% ZrO2 P, O, :0.5~3重量% :0~2重量% Sb<sub>2</sub>O, :0~2重量% As,O

の組成を有し、理論的光学的塩基性度が0.548以下 であることを特徴とする磁気ディスク基板用ガラス組成 物。

#### 【請求項2】酸化物として、

SiO<sub>2</sub> :66~75重量% :5.5~10重量% A 1, O, : 4~8.5重量% LizO Na<sub>2</sub>O :0~2重量% :0~2重量% K₂O

但し、Li,O+Na,O+K,O:4~9重量%

TiO, :2~6 重量% ZrO2 :3.8~6.5重量% : 1~2.5重量% P, O, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0~2重量% As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> :0~2重量%

の組成を有し、理論的光学的塩基性度が0.548以下 物。

#### 【請求項3】酸化物として、

S i O<sub>2</sub> :66~75重量% :5.5~7.5重量% A1,0, L i 2O :5~8.5重量% :0~2重量% Na₂O K, O :0~2重量%

但し、Li,O+Na,O+K,O:5~9重量%

:2~4重量% TiO<sub>2</sub> ZrO, :4.1~6重量% :1~2.5重量% P, O, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> :0~1重量%  $As_2O_1$ :0~1重量%

の組成を有し、理論的光学的塩基性度が0.548以下 であることを特徴とする磁気ディスク基板用ガラス組成 物。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の 磁気ディスク基板用ガラス組成物を、成形、研磨後、3 50℃から550℃の間の温度で、ガラス表面層のアル

属イオンでイオン交換し、強化したことを特徴とする磁 気ディスク基板。

【請求項5】請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の 磁気ディスク基板用ガラス組成物を、成形、熱処理、研 磨して作製された、主結晶相がLi,〇・2Si〇,及び スポジュメンの内の少なくとも1種であることを特徴と する磁気ディスク基板。

【請求項6】酸化物として、

SiO<sub>2</sub> :66~80重量% 10 A 1, O, :5.5~10重量% :3~8.5重量% LizO NazO :0~3重量% K, O :0~3重量%

但し、Li,O+Na,O+K,O:3~10重量%

TiO<sub>2</sub> :0.5~8重量% ZrO2 :3.5~8重量% P, O, :0.5~3重量% :0~2重量% Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> :0~2重量%

20 の組成を有するガラス組成物を、成形、熱処理、研磨し て作製された、主結晶相がLi,〇・2Si〇,及びスポ ジュメンの内の少なくとも1種であることを特徴とする 磁気ディスク基板。

【請求項7】結晶化度の合計が20容量%以上である請 求項5又は請求項6記載の磁気ディスク基板。

【請求項8】粉末法によるガラスの水溶出試験で、重量 減少が6×10-1g/cm<sup>2</sup>・h以下である請求項1乃至 請求項3のいずれかに記載の磁気ディスク基板用ガラス 組成物.

であることを特徴とする磁気ディスク基板用ガラス組成 30 【請求項9】粉末法によるガラス又は結晶化ガラスの水 溶出試験で、重量減少が6×10<sup>-7</sup>g/cm<sup>2</sup>・h以下で ある請求項4乃至請求項7のいずれかに記載の磁気ディ スク基板。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク基板 用ガラス組成物及び磁気ディスク基板に関する。さらに 詳しくは、本発明は、容易に成形することができ、ガラ ス熱処理によって主結晶相としてLi、〇・2Si〇、及 40 びスポジュメンの内の少なくとも1種を析出させた後に も、容易に研磨加工することができ、あるいは成形、研 磨後、ガラスをイオン交換することにより化学強化で き、優れた化学的耐久性、機械的強度、耐熱性、表面平 坦性、表面平滑性を有するコンピューターのハードディ スクなどに適した磁気ディスク基板を作製するための磁 気ディスク基板用ガラス組成物及び該組成物から得られ る磁気ディスク基板に関する。

#### [0002]

【従来の技術】磁気ディスクは、主としてコンピュータ カリ金属イオンを、イオン半径がより大きいアルカリ金 50 ーなどの記録媒体として使用されている。従来、磁気デ

ィスク基板材料としてアルミニウム合金が使用されてい るが、近年、磁気ディスクの小型化、薄型化、高記録密 度化の流れの中で、高平坦性、高平滑性への要望が高ま っており、アルミニウム合金では対応しきれないため、 これに変わる磁気ディスク基板材料が必要になってい る。磁気ディスク基板に必要な特性は、ディスク表面の 平坦性、平滑性や、ディスク基板の高強度、高硬度、化 学的耐久性、耐マイグレーション性、耐熱性などである が、アルミニウム合金は強度、硬度が劣るため、ディス クの厚みを厚くし、表面を硬化する必要がある。ディス クの厚みを薄くすると、うねりが発生し平坦度が悪化す るため、磁気ヘッドがディスクに衝突する回数が多くな り、ディスクの塑性変形を招き、データ破壊が起こる。 従って、フライングハイト(磁気ヘッドと磁気ディスク の隙間)を小さくすることができないため、記録密度が 上がらないという問題が生じる。また、磁性膜が白金系 になると、アルミニウム合金基板と磁性膜の間に電位が 発生し、電界腐食を引き起こすため、磁性膜が侵される といった現象を引き起こす。これらのアルミニウム合金 の問題点を解決する基板材料として、磁気ディスク用ガ ラス基板が開発されている。磁気ディスク用ガラス基板 は、大別するとイオン交換タイプと、結晶化ガラスタイ プとの2つに分けられる。イオン交換タイプの磁気ディ スク用ガラス基板は、一般的にガラス中に多量のアルカ リ成分を有しており、アルカリ成分が基板表面に移動し て磁気膜特性を悪化させる現象をしばしば引き起こす。 結晶化ガラスタイプの磁気ディスク用ガラス基板は、ア ルミニウム合金基板やイオン交換タイプのガラス基板の 欠点を補うべく開発されたものであり、これまでに種々 のガラス組成物が提案されている。特開昭62-725 47号公報、特開平4-144938号公報、特開平6 -329440号公報、特開平7-157331号公報 などに提案されているLi、O-SiO、系結晶化ガラス は、ガラス組成物中に多量のアルカリ成分を含んだもの である。このようなガラス組成物は、析出結晶中にある 程度のアルカリ成分が取り込まれることによってアルカ リイオンの移動を抑えるが、結晶でないマトリックスガ ラス中にも相当量のアルカリ成分が残存するため、イオ ン交換タイプと同様にアルカリマイグレーションにより 磁気膜特性を悪化させるおそれがあり、今後の薄膜化へ の対応が困難である。特に、特開昭62-72547号 公報に提案されているLi,O・SiO,(リチウムメタ シリケート)結晶は、化学的耐久性が非常に悪く、アル カリマイグレーションにより磁気膜特性を悪化させるお それがある。特開平6-329439号公報に提案され ているLi、O-Al、O。-SiO、系結晶化ガラスは、 1550℃以上の髙温溶融が必要であり、溶融、成形が 容易ではない。また、特開平7-247138号公報に 提案されているLi,O-Al,O,-SiO,系結晶化ガ

ラスは、ガラス組成中のSiOz成分が少ないため、化

学的耐久性が劣るという欠点がある。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、容易に成形 することができ、ガラスの熱処理による結晶化後、容易 に研磨加工することができ、あるいは成形、研磨後、ガ ラスをイオン交換することにより化学強化でき、優れた 化学的耐久性、機械的強度、耐熱性、表面平滑性、表面 平坦性を有し、アルカリマイグレーションによる磁気膜 特性の劣化の少ない磁気ディスク基板を作製するための 磁気ディスク基板用ガラス組成物及び磁気ディスク基板 を提供することを目的としてなされたものである。 [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課 題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ガラスの理論的 光学的塩基性度が0.548以下であり、イオン交換に よる強化が可能であり、熱処理した場合は主結晶相とし てLi<sub>2</sub>O・2SiO<sub>2</sub>及びスポジュメンの内の少なくと も1種の結晶が析出する特定組成のガラス組成物が、容 易に成形、研磨加工することができ、しかも磁気ディス ク基板としたときの化学的特性及び物理的特性に優れる ことを見いだし、この知見に基づいて本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、(1)酸化物として、 SiO<sub>2</sub>:66~80重量%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:5~15重量 %、Li<sub>2</sub>O:3~8.5重量%、Na<sub>2</sub>O:0~3重量 %、K<sub>2</sub>O:0~3重量%、但し、Li<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O+ K<sub>2</sub>O:3~10重量%、TiO<sub>2</sub>:0.5~8重量%、 ZrO<sub>2</sub>:3.5~8重量%、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:0.5~3重量 %、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~2重量%、As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~2重量% の組成を有し、理論的光学的塩基性度が0.548以下 であることを特徴とする磁気ディスク基板用ガラス組成 物、(2)酸化物として、SiO1:66~75重量 %、A1,O,:5.5~10重量%、Li,O:4~8. 5重量%、Na,O:0~2重量%、K,O:0~2重量 %、但し、Li,O+Na,O+K,O:4~9重量%、 TiO<sub>2</sub>:2~6重量%、ZrO<sub>2</sub>:3.8~6.5重量 %、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:1~2.5重量%、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~2重量 %、As,O::0~2重量%の組成を有し、理論的光学 的塩基性度が0.548以下であることを特徴とする磁 気ディスク基板用ガラス組成物、(3)酸化物として、  $SiO_{3}:66\sim75$  **==**  $\frac{1}{2}$   $\frac{1$ 重量%、Li,O:5~8.5重量%、Na,O:0~2 重量%、K<sub>2</sub>O:0~2重量%、但し、Li<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub> O+K<sub>2</sub>O:5~9重量%、TiO<sub>2</sub>:2~4重量%、Z rO<sub>2</sub>:4.1~6重量%、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:1~2.5重量%、 Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~1重量%、As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~1重量%の組 成を有し、理論的光学的塩基性度が0.548以下であ ることを特徴とする磁気ディスク基板用ガラス組成物、 (4) 第(1)項乃至第(3)項のいずれかに記載の磁気デ ィスク基板用ガラス組成物を、成形、研磨後、350℃ 50 から550℃の間の温度で、ガラス表面層のアルカリ金

属イオンを、イオン半径がより大きいアルカリ金属イオ ンでイオン交換し、強化したことを特徴とする磁気ディ スク基板、(5)第(1)項乃至第(3)項のいずれかに記 載の磁気ディスク基板用ガラス組成物を、成形、熱処 理、研磨して作製された、主結晶相がLi,O・2Si O, 及びスポジュメンの内の少なくとも1種であること を特徴とする磁気ディスク基板、(6)酸化物として、 SiO,:66~80重量%、A1,O,:5.5~10重 量%、Li,O:3~8.5重量%、Na,O:0~3重 量%、K,O:0~3重量%、但し、Li,O+Na,O +K<sub>2</sub>O:3~10重量%、TiO<sub>2</sub>:0.5~8重量 %、ZrOz:3.5~8重量%、PzO;:0.5~3重 量%、Sb,O,:0~2重量%、As,O,:0~2重量 %の組成を有するガラス組成物を、成形、熱処理、研磨 して作製された、主結晶相がLizO・2SiOz及びス ポジュメンの内の少なくとも1種であることを特徴とす る磁気ディスク基板、(7)結晶化度の合計が20容量 %以上である第(5)項又は第(6)項記載の磁気ディスク 基板、(8)粉末法によるガラスの水溶出試験で、重量 減少が6×10-7g/cm²・h以下である第(1)項乃至 第(3)項のいずれかに記載の磁気ディスク基板用ガラス 組成物、及び、(9)粉末法によるガラス又は結晶化ガ ラスの水溶出試験で、重量減少が6×10-7g/cm²・ h以下である第(4)項乃至第(7)項のいずれかに記載の 磁気ディスク基板、を提供するものである。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明の磁気ディスク基板用ガラ ス組成物は、酸化物として、Si〇: 166~80重量 %、A1,O,:5~15重量%、Li,O:3~8.5重 量%、Na2O:0~3重量%、K2O:0~3重量%、 但し、Li,O+Na,O+K,O:3~10重量%、T iO<sub>2</sub>:0.5~8重量%、ZrO<sub>2</sub>:3.5~8重量%、 P,O,:0.5~3重量%、Sb,O,:0~2重量%、 A s , O , : 0 ~ 2 重量%の組成を有し、理論的光学的塩 基性度が0.548以下である。本発明の磁気ディスク 基板用ガラス組成物は、必要に応じて、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0~5 重量%、MgO:0~8重量%、CaO:0~5重量 %、SrO:0~5重量%、BaO:0~5重量%、Z nO:0~5重量%、PbO:0~3重量%などの酸化 物を含有せしめることができる。本発明組成物におい て、SiOzはガラス形成酸化物であり、ガラスを熱処 理する場合は、主結晶相であるLi<sub>2</sub>O・2SiO<sub>2</sub>及び スポジュメン(Li,O·Al,O,·4SiO,)の構成 成分である。SiOzの含有量が66重量%未満である と、ガラスの理論的光学的塩基性度を0.548以下に することが困難になり、化学的耐久性が悪化する上に、 結晶化する場合は上記の結晶が析出し難くなるおそれが ある。SiO,の含有量が80重量%を超えると、溶融 温度が上がりすぎて生産が困難になるおそれがある。S iO,の含有量は、生産性を考慮すると、66~75重

量%であることがより好ましい。本発明組成物において、A1,O,はガラス中間酸化物であり、ガラスを熱処理する場合は、主結晶相であるスポジュメンの構成成分である。A1,O,の含有量が5重量%未満であると、化学的耐久性が悪化する。A1,O,の含有量が15重量%を超えると、溶融温度が高くなり生産が困難になるおそれがある。A1,O,の含有量は、化学的耐久性や生産性を考慮すると、5.5~10重量%であることがより好ましく、5.5~7.5重量%であることがさらに好ましい。

【0006】本発明組成物において、Li,Oは融剤と しての役割を果たすと共に、ガラスをイオン交換し、強 化する場合は、アルカリ金属イオンの中で最も小さいイ オンなので、ナトリウムやカリウムなどのイオン半径が より大きいアルカリ金属イオンとイオン交換してガラス を強化し得る成分であり、ガラスを熱処理する場合は、 主結晶相であるLi、〇・2Si〇、及びスポジュメンの 構成成分である。Li,Oの含有量が3重量%未満であ ると、溶融温度が高くなりすぎる上に、イオン交換し、 強化する場合は、イオン交換し難く、特性が向上しない おそれがある。また、ガラスを熱処理する場合は、Li ,O・2 S i O,及びスポジュメン結晶が析出し難くなる おそれがある。Li,Oの含有量が8.5重量%を超える と、ガラスの理論的光学的塩基性度を0.548以下に し難く、化学的耐久性及び耐マイグレーション性を悪化 させ、磁気膜特性に悪影響を与えるおそれがある。Li 2〇の含有量は、生産性、イオン交換量、化学的耐久性 や耐マイグレーション性を考慮すると、4~8.5重量 %であることがより好ましく、5~8.5重量%である 30 ことがさらに好ましい。本発明組成物において、Na, ○及びK,○は融剤であり、組成物の溶融性を改良する とともに、Na、Oはカリウムなどのナトリウムよりイ オン半径がより大きいアルカリ金属イオンとイオン交換 してガラスを強化し得る成分である。磁気ディスク基板 の化学的耐久性、耐マイグレーション性を考慮すると、 Li<sub>2</sub>Oのみを単独で使用するよりも、これらのアルカ リ成分をLi,Oと併用し、複数種のアルカリ成分を使 用することにより化学的耐久性の低下やアルカリマイグ レーションを防ぐことが好ましい。Na,O又はK,Oの 40 含有量が3重量%を超えるか、あるいは、Li,O+N a, O+K, Oの合計の含有量が10重量%を超えると、 ガラスの理論的光学的塩基性度を0.548以下に保つ ととが困難になり、磁気ディスク基板の化学的耐久性が 低下するとともに耐マイグレーション性も低下するおそ れがある。Na、O及びK、Oのそれぞれの含有量は、化 学的耐久性、耐マイグレーション性やガラスの理論的光 学的塩基性度を考慮すると、2重量%以下であることが より好ましい。また、Li,O+Na,O+K,Oの合計 量は4~9重量%であることがより好ましく、5~9重 50 量%であることがさらに好ましい。

【0007】本発明組成物において、TiO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub> 及びP2O。は、結晶化促進剤としての役割を果たす。さ らに、TiO₁は融剤としての役割や、レーザーテクス チャーを行う場合には、敏感にレーザー光と反応して磁 気ディスク基板表面の構造変化を誘起する重要な成分と しての役割も果たす。TiO,の含有量が0.5重量%未 満であると、結晶化促進剤としての効果、融剤としての 効果及びレーザー反応成分としての効果が乏しく、ま た、Ti〇2の含有量が8重量%を超えると、ガラス成 形時に失透しやすくなるおそれがある。TiOzの含有 量は、結晶化促進剤としての効果、融剤としての効果、 レーザー反応成分としての効果及び失透性を考慮する と、2~6重量%であることがより好ましく、2~4重 量%であることがさらに好ましい。 Z r O₁は化学的耐 久性を顕著に向上させる働きも有するが、Zr○₂の含 有量が3.5重量%未満であると、化学的耐久性の向上 が認められないおそれがある。ZrОҳの含有量が8重 量%を超えると、ガラス中に溶けきれず、未溶融物とな るおそれがある。Zr〇₂の含有量は、結晶化促進剤と しての効果、化学的耐久性や溶融性を考慮すると、3.  $8\sim6.5$ 重量%であることがより好ましく、 $4.1\sim6$ 重量%であることがさらに好ましい。P2O,は融剤とし ての働き、特にZrOzの難溶融性を著しく改善する働 きもあるが、P,O,の含有量がO.5重量%未満である と、結晶化促進剤としての効果及びZrOzの難溶融性 の改善効果が乏しく、また、P,O,の含有量が3重量% を超えると溶融ルツボの腐食量が増大するおそれがあ る。P,O,の含有量は、結晶化促進剤としての効果、融 剤としての効果、特にZrO,の難溶融性の改善効果及 びルツボの腐食性を考慮すると、1~2.5重量%であ ることがより好ましい。本発明組成物において、Sb, O,及びAs,O,は、ガラス溶融時の清澄剤としての役 割を果たす。Sb,O,若しくはAs,O,を単独で用いる 場合、又は併用する場合の含有量が0.1重量%未満で あると、清澄剤としての作用に乏しくなるおそれがある が、2重量%以下で十分清澄効果を発揮する。As2O3 は清澄剤としてSb,O,と併用又は単独で用いることが できるが、環境の点からは使用しないことが好ましい。 Sb,〇,+As,〇,の合計量は、清澄効果を考慮すると 0.2~1重量%であることがより好ましい。 【0008】本発明組成物に必要に応じて含有せしめる ことができるB<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、ZnO及びPbOは、融剤として の働きを有する。B,O,の含有量が5重量%を超える と、化学的耐久性を悪化させ、熱処理する場合は結晶化 を抑制するおそれがある。B,O,の含有量は、3.5重

 $\Lambda = \Sigma \left\{ \left( z_1 \times r_1 \right) / 2 \gamma_1 \right\}$ 

式中のz, は各酸化物成分中のカチオンiの酸化数を、r, はガラス中の全酸素数に対する各酸化物成分中に存在する、すなわちガラス中に存在するカチオンiの数

量%以下であることがより好ましい。 Z n ○は化学的耐米

\* 久性を向上させる働きを有するが、 Zn Oの含有量が5 重量%を超えると、熱処理する場合は析出結晶量が少な くなるおそれがある。 Zn Oの含有量は、4.5重量% 以下であることがより好ましい。Pb〇は融剤として顕 著な働きがあるが、環境の点からは使用しないことが好 ましい。PbOを使用する場合は、その含有量が3重量 %を超えると、化学的耐久性を悪化させ、また、熱処理 する場合は析出結晶量が少なくなるおそれがある。Pb 〇の含有量は、1.5重量%以下であることがより好ま しい。本発明組成物に必要に応じて含有せしめることが できるMgO、CaO、SrO及びBaOは、ガラス修 飾酸化物であり、作業温度幅を広げる働きがある。特 に、MgOは化学的耐久性を向上させる働きを有する。 MgOの含有量が8重量%を超えるか、又はCaO、S r O若しくはBaOの含有量が5重量%を超えると、ガ ラスが安定になりすぎて析出結晶量が少なくなるおそれ がある。析出結晶量を考慮すると、Mg〇の含有量は5 重量%以下であることがより好ましく、CaO、Sr O、BaOの含有量は、それぞれ3重量%以下であるこ とがより好ましい。また、磁気ディスク基板のテクスチ ャーには、ひとつの方法としてレーザー光などを使用す る場合がある。その場合は、使用する光の波長に吸収を 有するCo、Mn、V、Cr、Cu、Au、Ag、P t, Mo, Ni, Fe, Te, Ce, Se, Nd, P r、Sm、Er、Sなどの元素又はこれらの元素を含む 化合物を、磁気ディスクとしての特性に悪影響を与えな い範囲で、ガラス組成中に含有させることができる。 【0009】本発明の磁気ディスク基板用ガラス組成物 は、理論的光学的塩基性度が0.548以下である。ガ 30 ラス組成物の理論的光学的塩基性度がこのように低い と、ガラス中に少量のアルカリが含まれていても磁気デ ィスク基板に必要かつ重要な特性である化学的耐久性に 優れており、信頼性の高い磁気ディスク基板を得ること ができる。本発明において、磁気ディスク基板用ガラス 組成物の理論的光学的塩基性度は、0.544以下であ ることがより好ましく、0.540以下であることがさ らに好ましい。ガラスの理論的光学的塩基性度(The oretical OpticalBasicity) とは、J. A. DuffyとM. D. Ingramが、 1975年に、Journal of Inorgan ic and Nuclear Chemistry, 第37巻、1203頁、及び、Physics and Chemistry of Glasses、第16巻、 第6号、119頁に発表した論文に掲載されたものであ り、ガラスの理論的光学的塩基性度Λは次式により計算

... (1)

される。

を、 $\gamma$ ,はカチオン i の塩基性度調整パラメーターを表す。ここで $\gamma$ ,はし、Paulingの電気陰性度 $\chi$ ,か 50 ら、次式により求めることができる。 $\gamma_1 = 1.36 \times$ 

 $(\chi_1 - 0.26)$  したがって、ガラスの理論的光学的塩\* \*基性度 $\Lambda$ は、次式により表される。

 $\Lambda = \Sigma \{ (z_1 \times r_1) / (2.72 \times \chi_1 - 0.707) \} \dots (2)$ 

例として、SiO,:72.0モル%、Al,O,:3.6 モル%、Li,O:10.3モル%、K,O:1.0モル%、TiO,:3.4モル%、ZrO,:2.1モル%、P,O,:1.0モル%、MgO:3.0モル%、CaO:2.1モル%、ZnO:1.5モル%の組成を有するガラスについて、Λを計算する。χ,については、「化学便覧基礎編、改訂3版」(丸善、昭和59年発行)II-589頁に記載されているPaulingの電気陰性度の値を用いる。z,の値は酸化物の構造より、χ,の値はPaulingの電気陰性度として、第1表のごとく求められる。

[0010]

#### 【表1】

#### 第1表

	Z i	<b>%</b> (
SiO <sub>2</sub>	4	1.8
A 1 2 O 3	3	1.5
LizO	1	1.0
K <sub>2</sub> O	1	0.8
TiO2	4	1.5
ZrO2	4	1.4
P2O5	5	2. 1
MgO	2	1.2
CaO	. 2	1.0
ZnO	2	1.6

※【0011】次にr,の値を求める。r,の値を求めるために、まずガラス中の全酸素数を計算する。全酸素数は、ガラスを構成している各酸化物の酸素数の和として、下記のごとく求められる。

SiO<sub>2</sub>  $: 0.720 \times 2 = 1.440$  $A1_2O_3$ : 0.036×3=0.108  $: 0.103 \times 1 = 0.103$ Li<sub>2</sub>O K<sub>2</sub>O  $: 0.010 \times 1 = 0.010$ TiO2  $: 0.034 \times 2 = 0.068$ ZrO2  $: 0.021 \times 2 = 0.042$  $: 0.010 \times 5 = 0.050$  $P_2O_5$ MgO  $: 0.030 \times 1 = 0.030$ CaO  $: 0.021 \times 1 = 0.021$ ZnO  $: 0.015 \times 1 = 0.015$ 合計 1.887

各カチオンのr,は、得られた全酸素数を1としたとき の各カチオンの数として求めることができる。例えば、 20 SiO<sub>2</sub>については次式から求められる。

**※**30

 $SiO_{i}$ :  $(0.720\times1)/1.887=0.3816$ 

各カチオンのr, について、上記のどとく計算した結果 を第2表に示す。

[0012]

【表2】

第2表

	r i
S i O <sub>2</sub>	0.3816
Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	0.0382
Li2O	0.1092
K <sub>2</sub> O	0.0106
TiO2	0.0180
ZrO2	0.0111
P2O5	0.0106
MgO	0.0159
CaO	0.0111
ZnO	0.0079

【0013】第1表に示したz,、x,の値及び第2表に 示した r, の値を理論的光学的塩基性度の式(2) に代 入して計算すると、上記のガラス組成物の理論的光学的 塩基性度は0.5337となる。本発明の磁気ディスク 基板用ガラス組成物は、ガラスを溶融、成形、研磨加工 後、例えば、NaNO,やKNO,などの溶融塩中にガラ スを浸漬するなど公知の方法により、イオン交換し、強 化を行うことができる。処理温度は、NaNO,やKN 40 ○,などの融点よりも高い約350℃から、ガラス組成 物のガラス転移温度よりも低い約550℃の間の温度で 行う。また、イオン交換処理時間は、10時間以上とす ることが好ましい。イオン交換処理により、ガラス表面 層のリチウムイオンが、イオン半径のより大きいナトリ ウムイオンやカリウムイオンなどと交換され、また、ガ ラス中にNa,Oが含まれている場合は、ナトリウムイ オンが、イオン半径のより大きいカリウムイオンなどと 交換される。これらのイオン交換により、ガラス表面に 圧縮応力層が形成されるため、強度が高い強化ガラス磁

50 気ディスク基板を得ることができる。本発明の磁気ディ

スク基板用ガラス組成物は、熱処理することにより、主 結晶相としてLi,O・2SiO,及びスポジュメンの内 の少なくとも1種が析出する。Li,O・2SiO,結晶 は棒状であり、機械的強度の高い結晶であるが、結晶サ イズが1µmを超えると研磨加工性が悪化するため、T iO,、ZrO,、P,O,などの適度な結晶化促進剤の使 用及び適切な結晶化処理により、結晶サイズを1μm以 下にすることが好ましく、0.5μm以下にすることが より好ましい。スポジュメン結晶は粒状結晶であり、T iO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>などの結晶化促進剤の使用及び 適切な結晶化処理により、Li,O・2SiO,結晶と同 程度の微細な結晶を均一に得ることができる。今後の磁 気ディスクに要求される高記録密度化を達成するために は、平滑度の極めて高い、ディスク基板の面精度が必要 になる。その場合は、Li,O・2SiOz結晶が主結晶 相で、スポジュメン結晶が析出しないことが好ましい。 Li,O・2SiO,結晶が主結晶相でありスポジュメン 結晶が析出しない場合には、結晶化処理前に比べ残存ガ ラスマトリックス中のA1,O,成分比が高くなるため、 ガラス相の化学的耐久性が高くなる。その結果、結晶相 とマトリックスガラス相の化学的耐久性の差が少なくな るため、両相の研磨スピードの差が小さく、LizO・ 2 S i O,の微細結晶が析出した結晶化ガラスから、極 めて表面平滑度の高いディスク基板を得ることができ る。一方、スポジュメン結晶が多量に析出する場合は、 結晶化処理前に比べ残存ガラスマトリックス中のA1, O,成分比が減少するため、ガラス相の化学的耐久性が やや劣るとともに、スポジュメン結晶の化学的耐久性が Li,O・2SiOz結晶よりも高いため、結晶相とマト リックスガラス相の化学的耐久性の差が大きくなる。そ の結果、両相の研磨スピードの差が若干大きくなり、研 磨と同時にテクスチャー形成が可能となる。従って、ス ボジュメン結晶の量及びサイズ、スポジュメン結晶とし i,O・2SiOz結晶の比率を制御することにより、極 めて平滑な基板表面から用途に応じた所望のテクスチャ 一を形成した基板表面まで、自由に得ることができる。 また、スポジュメン結晶とLi,O・2SiO,結晶の比 率を制御することにより、磁気ディスク基板の熱膨張係 数を80×10<sup>-7</sup>/℃~110×10<sup>-7</sup>/℃の間で制御 することも可能である。Li<sub>2</sub>O・2SiO<sub>2</sub>結晶が最大 量の結晶相となるのは、最終の結晶化処理温度を約72 0℃以下にした場合であり、スポジュメン結晶が最大量 の結晶相となるのは、最終の結晶化処理温度を約730 ℃以上した場合である。本発明の磁気ディスク基板にお いては、主結晶相であるLi,O・2SiO,及びスポジ ュメン結晶とその他の結晶の合計の結晶化度は、粉末X 線回折による検量線法で、20容量%以上であることが 好ましい。結晶化度の合計が20容量%未満であると、 磁気ディスク基板として満足のいく機械的強度が得られ ないおそれがある。

【0014】本発明の磁気ディスク基板用ガラス組成物 は、熱処理した場合、主結晶相以外に副結晶相としてリ チウム長石( $Li_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ )、 $\alpha-\phi$ オーツ、β-クリストバライト(SiO<sub>2</sub>)などが析出 する場合があるが、これらの副結晶相の析出によって、 本発明組成物の特性は損なわれない。α-クォーツは、 約650℃から析出し始め、スポジュメン結晶が析出し 始めると結晶量が下がる挙動を示す。本発明の磁気ディ スク基板用ガラス組成物は、粉末法によるガラスの水溶 10 出試験で、重量減少が6×10-7g/cm<sup>2</sup>・h以下であ ることが好ましい。粉末法によるガラスの水溶出試験 で、重量減少が6×10<sup>-7</sup>g/cm<sup>2</sup>・h以下であれば、 ガラス中に少量のアルカリが含まれていても、磁気ディ スク基板に必要かつ重要な特性である化学的耐久性に優 れ、信頼性の高い磁気ディスク基板を得ることができ る。粉末法によるガラスの水溶出試験での重量減少は、 4×10-1g/cm・h以下であることがより好まし く、 $2 \times 10^{-7}$ g/cm・h以下であることがさらに好 ましい。本発明の磁気ディスク基板は、粉末法によるガ ラス又は結晶化ガラス(以下まとめて「ガラス」と記 す。)の水溶出試験で、重量減少が6×10<sup>-7</sup>g/cm² ・h以下であることが好ましい。粉末法によるガラスの 水溶出試験で、重量減少が6×10-7g/cm²・h以下 であれば、ガラス中に少量のアルカリが含まれていて も、磁気ディスク基板に必要かつ重要な特性である化学 的耐久性に優れ、信頼性の高い磁気ディスク基板とな る。粉末法によるガラスの水溶出試験での重量減少は、 4×10<sup>-7</sup>g/cm・h以下であることがより好まし く、 $2 \times 10^{-7}$  g / cm $^{2}$  · h であることがさらに好まし 30 ¢1°

【0015】本発明でいう粉末法によるガラス又は結晶 化ガラス(以下まとめて「ガラス」と記す。)の水溶出 試験方法について説明する。まず、ガラスを乳鉢などで 粉砕する。粉砕されたガラス粉末を目の開きが1.70m mと0.85mmの標準篩でふるい、1.70mmを通り0.8 5 mmの上に残ったガラス粉末を試料とする。このガラス 粉末を、ジエチルエーテルの入ったビーカーに入れ、超 音波洗浄を2~3分かけ、白濁した液を捨てる。ジエチ ルエーテルを用いた超音波洗浄をもう1度繰り返したの 40 ち、メタノールを用いて超音波洗浄を2~3分かけ、液 を捨てる。その後、ガラス粉末をビーカーに入れたまま 120℃で1時間乾燥し、デシケータ内で放冷する。洗 浄されたガラス粉末を、表面積が同一になるように、あ らかじめ測定した比重と同数値のグラム数だけ秤取し、 70メッシュ(0.21mm)の白金製の籠に入れる。白 金製の籠に入れたままメタノールの入ったビーカーに浸 け、超音波洗浄を2~3分かけた後、白金製の籠をビー カーから引き出し、120℃で1時間乾燥し、デシケー タ内で放冷する。放冷されたガラス粉末入りの白金製の 50 籠を、10-1g単位まで秤量する。次にテフロン製の容

(1)結晶相 得られた研磨成形体を、X線回折装置を用いて測定した。 (2)結晶化度

14

器に秤量したガラス粉末入りの白金製の籠を入れ、次いでイオン交換水100㎡を入れ、テフロン製のふたで密閉する。これをあらかじめ80℃にしておいた恒温器に入れ、66時間放置して耐水試験をする。66時間後、テフロン製の容器からガラス粉末の入った白金製の籠を取り出し、メタノール中で2~3分超音波洗浄する。超音波洗浄後、120℃で1時間乾燥させ、デシケータ内で放冷する。放冷されたガラス粉末入りの白金製の籠を、10-5g単位まで秤量し、耐水試験前後の重量から、重量減少を求める。重量減少と、あらかじめ比表面10積計を用いて測定した表面積の値から、1cm²、1時間当たりの重量減少を計算する。また、1種類のガラスに対し3回試験を繰り返し、その平均値をガラスの水溶出試験の重量減少とする。

13

【0016】本発明の磁気ディスク基板は、本発明の磁 気ディスク基板用ガラス組成物を成形し、イオン交換し て強化する場合は研磨後にイオン交換して作製し、また 結晶化の場合は熱処理後に研磨して作製した磁気ディス ク基板である。ガラス組成物の成形方法には特に制限は は直接通電することにより溶融し、プレス成形、あるい は鋳込みースライス成形などにより成形することができ る。成形品の処理方法には特に制限はなく、例えば、熱 処理の場合は、はじめに比較的低温で熱処理して多数の 結晶核を発生せしめたのち、温度を上げて結晶を成長さ せることが、微細な結晶を得る上で好ましい。処理を終 えた成形品の研磨方法には特に制限はなく、例えば、合 成ダイヤモンド、酸化ケイ素、炭化ケイ素、酸化アルミ ニウム、酸化ジルコニウム、炭化ホウ素、c-BNなど の合成砥粒や、天然ダイヤモンド、酸化セリウムなどの 天然砥粒を用いて、公知の方法により研磨することがで きる。本発明の磁気ディスク基板用ガラス組成物を使用 することにより、イオン交換した場合も、また、熱処理 した場合も、高強度、高硬度で化学的耐久性、耐熱性に 優れた磁気ディスク基板を得ることができる。本発明組 成物は、理論的光学的塩基性度が0.548以下と低い ため、高い化学的耐久性を達成することができ、また耐 マイグレーション性にも優れているため、磁気膜特性を 最善に保つことができる。

[0017]

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によりなんら限定されるものではない。なお、実施例及び比較例において使用した原料は、 $SiO_2$ 、 $Al(OH)_3$ 、 $Li_2CO_3$ 、 $Na_2CO_3$ 、 $K_2CO_3$ 、 $TiO_2$ 、 $ZrO_2$ 、 $AlPO_4$ 、 $Sb_2O_3$ 、 $As_2O_3$ 、 $H_3BO_3$ 、 $Mg(OH)_2$ 、 $CaCO_3$ 、 $SrCO_3$ 、 $BaCO_3$ 、ZnOD ひPbO である。また、実施例及び比較例において、結晶相、結晶化度、抗折強度及び算術平均粗さRaは、下記の方法により測定した。

はじめに、求めようとする結晶相の検量線を作成した。例えば、スポジュメン結晶の場合は、スポジュメンの組成であるLi,O:Al,O;:SiO,=1:1:4となるように、Li,CO,、Al(OH),及びSiO,を秤量し、イソブロビルアルコールを加えて24時間湿式混合した。その後、イソブロビルアルコールを除去し、X線回折ピーク強度の増加がなくなるまで焼結してスポジュメン結晶を作製した。このスポジュメン結晶を粉砕し、結晶が析出していない母ガラス粉末と種々の割合で混合して、X線回折でのメインピーク4本についてピーク強度を測定し、検量線を作成した。ガラスを溶融、成形、熱処理、研磨後、結晶化度測定サンブルとした。測定サンブルをX線回折で測定し、あらかじめ作成した検量線から結晶化度を求めた。

#### (3) 抗折強度

なく、例えば、原料をタンク窯で加熱して溶解、あるい 20 ガラス成形体を熱処理したのちJIS R 1601に準は直接通電することにより溶融し、プレス成形、あるい じて加工し、又は、JIS R 1601に準じて加工しは鋳込みースライス成形などにより成形することができ たのちイオン交換処理し、3点曲げにより抗折強度を測る。成形品の処理方法には特に制限はなく、例えば、熱 定した。

#### (4)算術平均粗さRa

得られた研磨成形体を、原子間力顕微鏡(Digital Instruments社製)を用いて表面観察を行った。サンプル表面中で5カ所をランダムに選び、1カ所当たり10μm×10μmの視野中でランダムに4本の線を引き、それぞれのRaを算出した。これら合計 20カ所の平均を、算術平均粗さRaとした。

実施例1

ガラス組成が、SiOz:70.0重量%、AlzO;: 6.0重量%、Li<sub>2</sub>O:8.0重量%、TiO<sub>2</sub>:2.5 重量%、ZrO2:4.0重量%、P2O5:1.8重量 %、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.2重量%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.0重量%、C aO:2.0重量%、BaO:1.5重量%及びZnO: 2.0重量%となるよう各成分原料を秤量、混合した。 このガラスの組成をモル%表示すると、SiO::69. 87モル%、A1,O,:3.53モル%、Li,O:1 6.05モル%、TiO<sub>2</sub>:1.88モル%、ZrO<sub>2</sub>: 1.95 tu%, P,O,: 0.76 tu%, Sb,O,: 0.04モル%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:1.72モル%、CaO:2. 14モル%、BaO:0.59モル%及びZnO:1.4 7モル%となり、このガラス組成物の理論的光学的塩基 性度は、0.5395である。混合した原料を電気炉中 の白金ルツボに投入して1,450℃で5時間溶融し、 均質になるよう撹拌したのち、50×50×5mmの板状 に成形し、除歪、冷却してガラス成形体を得た。このガ ラス成形体を、600℃で3時間、続いて800℃で2 50 時間熱処理して、ガラス中に結晶を析出させた。さら

実施例1と同様にして、組成に応じて1,400~1,530℃で3~24時間溶融して得たガラス組成物を成形し、第3表に示す条件で熱処理して得られた結晶化ガラス成形体を、実施例1と同様に研磨した。得られた研磨成形体について、結晶相、結晶化度、粉末法による結晶化ガラスの水溶出試験における重量減少、抗折強度及び算術平均粗さRaを測定した。結果を第3表に示す。

#### 実施例8

実施例2~7

ガラス組成が、SiO,:70.0重量%、Al,O,: 6.0重量%、Li<sub>2</sub>O:8.0重量%、TiO<sub>2</sub>:2.5 重量%、ZrO2:4.0重量%、P2O5:1.8重量 %、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.2重量%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.0重量%、C aO:2.0重量%、BaO:1.5重量%及びZnO: 2.0重量%となるよう各成分原料を秤量、混合した。 このガラスの組成をモル%表示すると、SiO1:69. 87モル%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:3.53モル%、Li<sub>2</sub>O:1 6.05モル%、TiOz:1.88モル%、ZrOz: 1.95モル%、P,O,:0.76モル%、Sb,O,: 0.04モル%、B,O,:1.72モル%、CaO:2. 14モル%、BaO:0.59モル%及びZnO:1.4 7モル%となり、このガラス組成物の理論的光学的塩基 性度は、0.5395である。混合した原料を電気炉中 の白金ルツボに投入して1,450℃で5時間溶融し、 均質になるよう撹拌したのち、50×50×5mmの板状 に成形し、除歪、冷却してガラス成形体を得た。とのガ ラス成形体を、570℃で3時間、続いて670℃で2 時間熱処理して、ガラス中に結晶を析出させた。さら を用いて30分間ラッピングし、さらに平均粒径1μm の酸化セリウム砥粒で15分間ボリッシュして研磨成形 体を得た。この研磨成形体は、結晶相1がLi<sub>2</sub>O・2  $SiO_{1}$ であり、結晶相2は $\alpha$ -クオーツであった。結 晶化度は、Li<sub>2</sub>O・2SiO<sub>2</sub>が20容量%、α-クオ ーツが19容量%であった。また、粉末法による結晶化 ガラスの水溶出試験における重量減少は3.8×10<sup>-7</sup>

g/cm・hであり、抗折強度は230MPaであり、 算術平均粗さRaは7.0Aであった。

#### 実施例9~15

実施例8と同様にして、組成に応じて1,400~1,530°Cで3~24時間溶融して得たガラス組成物を成形し、第3表に示す条件で熱処理して得られた結晶化ガラス成形体を、実施例8と同様に研磨した。得られた研磨成形体について、結晶相、結晶化度、粉末法による結晶化ガラスの水溶出試験における重量減少、抗折強度及び10算術平均粗さRaを測定した。結果を第3表に示す。実施例16

ガラス組成が、SiO<sub>2</sub>:70.0重量%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:6.0重量%、Li<sub>2</sub>O:8.0重量%、TiO<sub>2</sub>:2.5重量%、ZrO<sub>2</sub>:4.0重量%、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:1.8重量%、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.2重量%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.0重量%、CaO:2.0重量%、BaO:1.5重量%及びZnO:2.0重量%となるよう各成分原料を秤量、混合した。このガラスの組成をモル%表示すると、SiO<sub>2</sub>:69.87モル%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:3.53モル%、Li<sub>2</sub>O:16.05モル%、TiO<sub>2</sub>:1.88モル%、ZrO<sub>2</sub>:

1.95 tu%, P,O,: 0.76 tu%, Sb,O,: 0.04モル%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:1.72モル%、CaO:2. 14モル%、BaO: 0.59モル%及びZnO: 1.4 7モル%となり、このガラス組成物の理論的光学的塩基 性度は、0.5395である。混合した原料を電気炉中 の白金ルツボに投入して1,450℃で5時間溶融し、 均質になるよう撹拌したのち、50×50×5mmの板状 に成形し、除歪、冷却してガラス成形体を得た。このガ ラス成形体の表面を平均粒径10μmの炭化ケイ素砥粒 30 を用いて30分間ラッピングし、さらに平均粒径1μm の酸化セリウム砥粒で15分間ポリッシュして研磨成形 体を得た。この研磨成形体を、450℃に保った溶融硝 酸ナトリウム浴に48時間浸漬して、ガラス表面層のリ チウムイオンをナトリウムイオンでイオン交換し、研磨 成形体を化学強化した。この研磨成形体は、粉末法によ るガラスの水溶出試験における重量減少は4.0×10 -'g/cm'・hであり、抗折強度は280MPaであ り、算術平均粗さRaは6.5点であった。

### 実施例17~18

に、成形体の表面を平均粒径  $10~\mu$ mの炭化ケイ素砥粒 40 実施例  $16~\ell$  に同様にして、ガラス組成物を成形、研磨しを用いて 3~0分間ラッピングし、さらに平均粒径  $1~\mu$  加 で得られた研磨成形体を、第 3~4 表に示す条件でイオン交の酸化セリウム砥粒で  $1~5~\ell$  分間ボリッシュして研磨成形体を得た。この研磨成形体は、結晶相  $1~\ell$  が上  $1~\ell$  2 であり、結晶相  $2~\ell$  は  $2~\ell$  であり、結晶相  $2~\ell$  は  $2~\ell$  であり、結晶相  $2~\ell$  に  $2~\ell$  であり、  $2~\ell$  に  $2~\ell$  であり、  $2~\ell$  に  $2~\ell$  であり、  $2~\ell$  に  $2~\ell$  に  $2~\ell$  であり、  $2~\ell$  に  $2~\ell$  であり、  $2~\ell$  に  $2~\ell$  に 2~

[0018]

【表3】

17

第3表-1

男3数一.		実施	医例 1	実施	医例 2	実施	 短例 3
		重量%	モル%	重量%	モル%	重量%	モル%
	SiOz	70.0	69.87	78.0	80.98	69.0	71.56
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.0	3.53	8.0	4.89	7. 0	4. 28
	L i 2O	8.0	16.05	3.5	7.30	4.0	8.34
	Na <sub>2</sub> O	-	_	_	_	_	
	K <sub>2</sub> O	-	_	·-	_	1.5	0.99
	T i O2	2.5	1.88	0.5	0.39	7.5	5.85
	Z r O <sub>2</sub>	4.0	1.95	4.0	2.03	3.5	1.77
	P2O5	1.8	0.76	2.3	1.01	0.9	0.40
組成	Sb2O3	0.2	0.04	0.2	0.04	0.1	0.02
	A s 203	_	-	1	-	1	
	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.0	1.72	1.0	0.90	2.0	1.79
	MgO	1	_	1.0	1.55	_	_
	CaO	2.0	2.14			4.5	5.00
	SrO	1		1	-	-	_
	BaO	1.5	0.59	1	-	1	_
	ZnO	2.0	1.47	1.0	0.77	-	_
	PbO			0.5	0.14	-	_
理論的光等 塩基性度	学的	0.5395		0.5086		0.5331	
処理方法		600℃×3h		700℃×3h		650℃×3h	
			℃×2h	900℃×2h		850℃×2h	
結晶相1			<sup>5</sup> ュメン	スポジュメン		スポジュメン	
結晶相2			25102	<u>α-2</u>	オーツ		オーツ
結晶相3			オーツ				<u> </u>
結晶化度	結晶相1		21		2 5		20
(容量%)	(容量%) 結晶相2 16			1	. 5		. 3
	結晶相3	1	. 4				
	<b>重量減少</b> g/cm²•h)	4	l. 1	0.6		2. 7	
抗折強度	(MPa)	2	70	2	30	2	0 0
算術平均和	lさRa(人)	1	8.0	1	6.0	1	4.5

[0019]

【表4】

第3表一		実施例4		実施	<b>転例</b> 5	実施	906
		重量%	モル%	重量%	モル%	重量%	モル%
	SiO2	73.0	73.99	66.0	69.89	67.0	67.48
	A 1 2 O 3	8.0	4.78	14.0	8.74	8. 2	4.87
	Li <sub>2</sub> O	7.0	14.27	6.0	12.78	7.8	15.80
	NagO	-	= .		_		_
	K <sub>2</sub> O	_	_	_	_	-	•••
	TiO2	5.0	3.81	6.0	4.78	5.3	4.01
	ZrO2	4.0	1.98	5.0	2.58	4.0	1.97
	P 2 O 5	2. 5	1.07	2. 5	1.12	2. 3	0.98
組成	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5	0.10	0.5	0.11	0. 2	0.04
	As20;	1			_		
	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		_				
	MgO					1. 9	<u>2.</u> 85
	CaO	_	`				
	SrO						
	BaO	_				1.3	0.51
	ZnO	_		-		2.0	1.49
	PbO			-	_		
理論的光色	学的	0.5298		0.5333		0.5435	
処理方法		650℃×3h		700℃×3h		580℃×3h	
			℃×2h	930℃×2h		780℃×2h	
結晶相1			きュメン	スポジュメン		スポジュメン	
結晶相2		βークリフ	<b>くトパライト</b>		7ム長石		· 2 S 1 O <sub>2</sub>
結晶相3							ストパライト
結晶化度			25		3 9		4
(容量%)	結晶相2		. 4		. 0	1	. 6
結晶相3			-				8
	ģ重量減少 g/ca²•h)	0	0. 8	1. 1		4.6	
抗折強度	(MPa)	2	10	2	90	270	
算術平均點	lさRa(Å)	1	6.5	_2	3. 0	1	8. 0

[0020]

21

第3表一3

第3表一	<u>.                                    </u>	実施	医例 7	実施	<b>医例</b> 8		実施例 9	
		重量%	モル%	重量%	モル%	重量%	モル%	
	SiO <sub>2</sub>	68.7	69.05	70.0	69.87	72.0	71.70	
	A 1 2 O 3	7. 0	4.15	6.0	3. 53	6.0	3.52	
	Li <sub>2</sub> O	7.9	15.97	8.0	16.05	8.0	16.02	
	Na2O	1	-	_	-	_	_	
	K <sub>2</sub> O	_	_		_	_		
	TiO2	4.0	3.02	2. 5	1.88	2. 7	2.02	
	ZrŌ2	4. 1	2.01	4. 0	1.95	4. 2	2.04	
	P 2 O 5	1.8	0.77	1.8	0.76	1.8	0.76	
組成	Sb2Oa	0.2	0.04	0.2	0.04	0. 2	0.04	
	A s 203			-				
	BsOs	1. 1	0.95	2.0	1.72	_	_	
	MgO				_		-	
	CaO	1.9	2.05	2.0	2.14	1.8	1.92	
	SrO		_	-				
	BaO	1.3	0.51	1.5	0.59	1.3	0.51	
	ZnO	2.0	1.48	2.0	1.47	2.0	1.47	
	PbO				_		_	
理論的光句 塩基性度	学的	0.5420		0.5395		0.5408		
処理方法		550℃×3h		570°C×3h		580℃×3h		
			℃×2h	670℃×2h		660℃×3h		
結晶相1			クュメン	Li <sub>2</sub> O · 2SiO <sub>2</sub>		Li20 · 2SiO2		
結晶相2			2 S i O <sub>2</sub>		オーツ	αークオーツ		
結晶相3			オーツ	_	-			
結晶化度	1,11		20		20		2 2	
(容量%)			. 3	1	. 9		. 5	
1 34 -1- 3	結晶相3	1	. 0					
水溶出試験重量減少 (×10 <sup>-7</sup> g/cm²·h)		_4	1. 2	3.8		0.8		
抗折強度	(MPa)	2	30		30		20	
算術平均和	lさRa(Å)	1	5.0	7	'. 0	6	. 5	

【0021】 【表6】

第3表一		実施	例10	実施	例11	実施	例12
		重量%	モル%	重量%		重量%	モル%
	SiO <sub>2</sub>	73.0	73.22	74.5	75.09	74.0	74.47
	A1:0s	8. 0	4.73	7.5	4.46	6.5	3.86
	Li <sub>2</sub> O	7.0	14.12	5.5	11.15	6.0	12.14
	Na2O	_	_	_		-	1
	K <sub>2</sub> O	ı	_	-	-		1
	TiO2	3.0	2.26	3.0	2.27	3.5	2.65
	ZrO2	4.2	2.05	5.0	2.46	4.5	2.21
	P20s	1.8	0.76	1.8	0.77	1.8	0.77
組成	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.2	0.04	0.2	0.04	0.2	0.04
	As <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	-	_			_	
	B2O8		1	1	1	-	-
	MgO	1.0	1.49	2.5	3.76	1.0	1.50
	CaO	1	1	ı		1.5	1.62
	SrO	_		_		_	-
	BaO	_		_	_	_	
	ZnO	1.8	1.33	-	-	1.0	0.74
	PbO						
理論的光学 塩基性度	学的	0.5321		0.5269		0.5300	
処理方法			℃×4h	600℃×3h		600℃×3h	
		690℃×3h		700℃×3h		690℃×3h	
枯晶相1			2SiO2	Li20.25i02		Li20-25i02	
枯晶相2			オーツ	αークオーツ		αークオーツ	
結晶相3			シュメン	スポジュメン		_	
結晶化度			L 5		l 3		14
(容量%) 結晶相2		3	4	]	13		3
結晶相3			4	1			
	水溶出試験重量減少 (×10 <sup>-7</sup> g/cm <sup>2</sup> ·h)		). 7	0.5		0.5	
抗折強度			30		20		20
算術平均和	lさRa(Å)	1	0.5	- {	3. 5	7	7. 5

【表7】

[0022]

25

第3表-5

क्र•ozx − ः		実施	例13	実施	例14	実統	医例 15
:		重量%	モル%	重量%	モル%	重量%	モル%
	SiO2	71.5	71.79	71.0	70.02	66.0	66.22
	A 1 2 O 3	6.5	3.85	6.0	3.49	6.0	3.55
	Li <sub>2</sub> O	7.5	15.15	8.5	16.86	8. 5	17.15
	Na <sub>2</sub> O			_	-		_
,	K <sub>2</sub> O	_		_	_	1.0	0.64
	TiO2	2.7	2.04	2.8	2.08	3.0	2.26
ŀ	ZrO2	4.2	2.06	4.5	2.16	4.0	1.96
:	P2O5	1.8	0.77	1.7	0.71	1.8	0.76
組成	Sb <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	0.2	0.04	0.2	0.04	0. 2	0.04
	As203			_	_	_	_
	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	_		0.5	0.43	2.0	1.73
!	MgO	1	_	0.8	1.18		
	CaO	1.8	1.94	1.7	1.80	3.0	3.23
] !	SrO	-	<u> </u>	_	-	-	
	BaO	1.3	0.51	1.3	0.50	2. 5	0.98
	ZnO	2.5	1.85	1.0	0.73	2.0	1.48
	PbO		<u> </u>	_			
理論的光質	<b>学的</b>	0.5389		0.5447		0.5517	
処理方法			℃×3h	560℃×4h		550℃×3h	
			℃×3h		℃×4h		℃×3h
結晶相1			2SiO2		2 S i O <sub>2</sub>		2\$ i O <sub>2</sub>
結晶相2		$\alpha - 2$	オーツ	αークオーツ		$\alpha - 2$	オーツ
結晶相3			_				<del>-</del>
結晶化度			20		2.5		23
(容量%)	結晶相2	1	4	1	7	<u> </u>	9
	結晶相3						
	水溶出試験重量減少 (×10 <sup>-7</sup> g/cm³·h)		1. 7	1.9		5.3	
抗折強度	(MPa)		10		10		10
算術平均和	さRa(人)	7	'. 0	7	7.0	7	7. 3

[0023]

【表8】

第3表-6								
ļ		実施	例16	実施例17		実施例18		
		重量%	モル%	重量%	モル%	重量%	モル%	
	SiOz	70.0	69.87	73.0	70.57	66.0	69.34	
	A 1 2 0 3	6.0	3.53	7.0	3.99	5. 5	3.41	
ļ	Li <sub>2</sub> O	8.0	16.05	5.5	10.69	5.0	10.57	
	Na <sub>2</sub> O	-				2.0	2.04	
	K <sub>2</sub> O	_	_					
	TiO2	2.5	1.88	1.5	1.09	2.0	1.58	
	ZrOz	4.0	1.95	3.5	1.65	7.0	3.59	
	P 2 O 5	1.8	0.76	0.8	0.33	2. 7	1.20	
組成	Sb,O3	0.2	0.04	0.2	0.04			
	As 203	1		-		0.3	0.10	
	BaOs	2.0	1.72	1.0	0.83	4.5	4.08	
	MgO			7.5	10.81	1.0	1.57	
	CaO	2.0	2.14		=			
	SrO					0.5	0.30	
	ВаО	1.5	0.59		_		_	
	ZnO	2.0	1.47			2.5	1.94	
	РЬО					1.0	0.28	
理論的光準	学的	0.5395		0.5356		0.5245		
		NaNO <sub>a</sub>		NaNOs		NaNO <sub>3</sub> +KNO <sub>3</sub>		
処理方法		4509	$C \times 48h$	400°C×72h		400℃×60h		
結晶相1			_					
結晶相2			_		<del>-</del>			
結晶相3	結晶相3							
結晶化度	結晶相1	晶相1 — — —						
(容量%)	(容量%) 結晶相2						<u> </u>	
	結晶相3						_	
水溶出試験重量減少 (×10 <sup>-7</sup> g/cm <sup>2</sup> ·h)			4. 0	3. 4		0.9		
	(MPa)	2	80	2	40		50	
算術平均	且さRa(Å)	(	3. 5		<b>3.0</b>		5.5	

【0024】実施例1~7の、本発明のガラス組成物か ら、成形、熱処理、研磨によって作製された研磨成形体 は、すべてスポジュメン結晶相を20容量%以上有し、 粉末法による結晶化ガラスの水溶出試験における重量減 少は4.6×10-7g/cm²・h以下であり、抗折強度は 200MPa以上であり、算術平均粗さRaは23.0Å 以下であって、磁気ディスク基板として好ましい特性を 備えている。実施例8~14の、本発明のガラス組成物 から、成形、熱処理、研磨によって作製された研磨成形 体は、すべてLi, O・2 SiO, 結晶相を13容量%以 40 比較例1 上有し、粉末法による結晶化ガラスの水溶出試験におけ る重量減少は3.8×10<sup>-1</sup>g/cm<sup>2</sup>・h以下であり、抗 折強度は210MPa以上であり、算術平均粗さRaは 10.5 A以下であって、磁気ディスク基板として好ま しい特性を備えている。また、実施例15の、本発明の ガラス組成物から、成形、熱処理、研磨によって作製さ れた研磨成形体は、理論的光学的塩基性度は0.548 を超えているが、Li<sub>2</sub>O・2SiO<sub>2</sub>結晶相を23容量 %有し、粉末法による結晶化ガラスの水溶出試験におけ る重量減少は5.3×10<sup>-1</sup>g/cm<sup>2</sup>・hであり、抗折強 50 gO:1.17モル%となり、このガラス組成物の理論

度は210MPaであり、算術平均粗さRaは7.3Åで あって、磁気ディスク基板として好ましい特性を備えて いる。さらに、実施例16~18の、本発明のガラス組 成物から、成形、研磨、イオン交換強化によって作製さ れた研磨成形体は、すべて粉末法によるガラスの水溶出 試験における重量減少は4.0×10-7g/cm2・h以下 であり、抗折強度は240MPa以上であり、算術平均 粗さRaは6.5A以下であって、磁気ディスク基板とし て好ましい特性を備えている。

ガラス組成が、SiO,:82.0重量%、Al,O,: 5.5重量%、Li<sub>2</sub>O:6.5重量%、TiO<sub>2</sub>:0.5 重量%、ZrO2:4.0重量%、P2O5:0.5重量 %、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.2重量%及びMgO:0.8重量%と なるよう各成分原料を秤量、混合した。このガラスの組 成をモル%表示すると、SiO::80.32モル%、A 1,0,:3.18モル%、Li,0:12.80モル%、 TiO<sub>2</sub>: 0.37 th%、ZrO<sub>2</sub>: 1.91 th%、P 20s:0.21モル%、Sb2O3:0.04モル%及びM 的光学的塩基性度は、0.5233である。混合した原料を電気炉中の白金ルツボに投入して加熱したが、SiO₂の量が多いために、1,550℃に達しても溶融しなかった。

#### 比較例2

ガラス組成が、SiO<sub>2</sub>:72.0重量%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 3.0重量%、Li<sub>2</sub>O:10.5重量%、K<sub>2</sub>O:2.0 重量%、ZrO,:3.0重量%、P,O,:1.8重量 %、Sb,O,:0.2重量%、B,O,:3.5重量%、M gO:2.0重量%及びBaO:2.0重量%となるよう 各成分原料を秤量、混合した。とのガラスの組成をモル %表示すると、SiO,:68.44モル%、Al,O,: 1.68モル%、Li<sub>2</sub>O:20.08モル%、K<sub>2</sub>O: 1.21 ELL, ZrO; : 1.39 ELL, P,O; : 0. 72モル%、Sb,O,:0.04モル%、B,O,:2.8 7モル%、MgO: 2.83モル%及びBaO: 0.74 モル%となり、このガラス組成物の理論的光学的塩基性 度は、0.5494である。混合した原料を電気炉中の 白金ルツボに投入して1,450℃で5時間溶融し、均 質になるよう撹拌したのち、50×50×5mmの板状に 成形し、除歪、冷却してガラス成形体を得た。このガラ ス成形体を、570℃で3時間、続いて780℃で2時 間熱処理して、ガラス中に結晶を析出させた。さらに、 成形体の表面を平均粒径10μmの炭化ケイ素砥粒を用 いて30分間ラッピングし、さらに平均粒径1μmの酸 化セリウム砥粒で15分間ボリッシュして研磨成形体を 得た。この研磨成形体は、Li,Oの量が多くAl,O, の量が少ないために、理論的光学的塩基性度が大きく、 粉末法による結晶化ガラスの水溶出試験における重量減 少は $6.5 \times 10^{-7}$  g/cm²・h とやや大きかった。 比較例3

ガラス組成が、SiO<sub>2</sub>:58.0重量%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:7.0重量%、Li<sub>2</sub>O:7.0重量%、K<sub>2</sub>O:2.0重量%、TiO<sub>2</sub>:2.0重量%、ZrO<sub>1</sub>:4.0重量%、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:1.8重量%、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.2重量%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:4.0重量%、MgO:5.0重量%、BaO:6.0重量%及びZnO:3.0重量%となるよう各成分原料を秤量、混合した。このガラスの組成をモル%表示すると、SiO<sub>2</sub>:59.67モル%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:4.24モル%、Li<sub>2</sub>O:14.48モル%、K<sub>2</sub>O:1.31モル%、TiO<sub>2</sub>:1.55モル%、ZrO<sub>2</sub>:2.01モル%、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.78モル%、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:0.04モル%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:3.55モル%、MgO:7.67モル%、

30

BaO: 2.42モル%及びZnO: 2.28モル%となり、このガラス組成物の理論的光学的塩基性度は、0.5564である。混合した原料を電気炉中の白金ルツボに投入して1,450℃で5時間溶融し、均質になるよう撹拌したのち、50×50×5mmの板状に成形し、除歪、冷却してガラス成形体を得た。このガラス成形体の表面を平均粒径10μmの炭化ケイ素砥粒を用いて30分間ラッピングし、さらに平均粒径1μmの酸化セリウム砥粒で15分間ボリッシュして研磨成形体を得た。この研磨成形体を、360℃に保った溶融硝酸ナトリウム浴に72時間浸漬して、ガラス表面層のリチウムイオンをナトリウムイオンでイオン交換し、研磨成形体を化学強化した。この研磨成形体は、粉末法によるガラスの水溶出試験における重量減少は17.5×10-7g/cm²・hと大きかった。

#### 比較例4

ガラス組成が、SiO,:66.0重量%、A1,O,:1 0.0重量%、Li<sub>2</sub>O:8.0重量%、TiO<sub>2</sub>:3.0 重量%、ZrОュ:3.5重量%、PュO;:0.8重量 20 %、Sb,O,:0.2重量%、B,O,:1.0重量%及び MgO: 7.5 重量%となるよう各成分原料を秤量、混 合した。このガラスの組成をモル%表示すると、SiO 2:63.23モル%、Al,O,:5.65モル%、Li, O: 15.42モル%、TiO;: 2.16モル%、Zr O,: 1.64モル%、P,O,: 0.32モル%、Sb,O j:0.04モル%、B2Oj:0.83モル%及びMg 〇:10.71モル%となり、このガラス組成物の理論 的光学的塩基性度は、0.5544である。混合した原 料を電気炉中の白金ルツボに投入して1,450℃で5 30 時間溶融し、均質になるよう撹拌したのち、50×50 ×5mmの板状に成形し、除歪、冷却してガラス成形体を 得た。このガラス成形体の表面を平均粒径10μmの炭 化ケイ素砥粒を用いて30分間ラッピングし、さらに平 均粒径1μmの酸化セリウム砥粒で15分間ポリッシュ して研磨成形体を得た。この研磨成形体を、400℃に 保った溶融硝酸ナトリウム浴に72時間浸漬して、ガラ ス表面層のリチウムイオンをナトリウムイオンでイオン 交換し、研磨成形体を化学強化した。との研磨成形体 は、粉末法によるガラスの水溶出試験における重量減少 40 は9.9×10<sup>-</sup>/g/cm<sup>2</sup>・hと大きかった。比較例1~ 4の結果を、まとめて第4表に示す。

[0025]

【表9】

32

第4表-1

		比喇	交例 1	比較例2		
		重量%	モル%	重量%	モル%	
	S i O2	82.0	80.32	72.0	68.44	
}	A 1 20 s	5.5	3.18	3.0	1.68	
	Li <sub>2</sub> O	6.5	12.80	10.5	20.08	
	Na <sub>2</sub> O	1	_	1	_	
	K <sub>2</sub> O		_	2.0	1. 21	
ļ	TiO2	0.5	0.37	ı	_	
	ZrOz	4.0	1.91	3.0	1, 39	
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.5	0.21	1.8	0.72	
組成	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.2	0.04	0.2	0.04	
	A 5 2 0 8	ı				
. '	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		1	3.5	2.87	
·	MgO	0.8	1.17	2. 0	2.83	
	CaO		_			
	SrO		1			
}	BaO	_	-	2.0	0.74	
j	ZnO		1	-	-	
	PbO	-				
理論的光色 塩基性度	学的	0.5233		0.5494		
処理方法				570°C×3h 780°C×2h		
結晶相1					2S i O <sub>2</sub>	
結晶相2					フオーツ	
結晶相3				<u>u</u> - )		
結晶化度	<b>姓耳坦1</b>			18		
(容量%)	結晶相2			10		
(TA)	結晶相3					
水溶出試圖	水浴出試験重量減少					
(×10-7	(×10 <sup>-7</sup> g/cm <sup>2</sup> h)		-		6.5	
抗折強度				230		
算術平均和	lさRa(Å)				3. 0	

[0026]

【表10】

第4表-2

<b>第4次</b> □ 4		比較例3		比較	交例 4	
	Î	重量%	モル%	重量%	モル%	
	SiO2	58.0	59.67	66.0	63.23	
	A 1 2 0 8	7.0	4.24	10.0	5.65	
	Li2O	7. 0	14.48	8.0	15.42	
	NasO			-	_	
	K <sub>2</sub> O	2. 0	1.31	_	-	
	TiO2	2.0	1.55	3.0	2.16	
	ZrO2	4. 0	2.01	3. 5	1.64	
	P2O5	1.8	0.78	0.8	0.32	
組成	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0. 2	0.04	0.2	0.04	
	As 208			1		
, i	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.0	3.55	1.0	0.83	
, '	MgO	5.0	7.67	7. 5	10.71	
	CaO	_		1		
	SrO	-	_	_	_	
	BaO	6.0	2.42	_	_	
	ZnO	3.0	2.28	_		
	PbO	-		_	_	
理論的光 塩基性度	学的	0. 8	5564	0.5544		
for the death			a NOs	NaNO <sub>8</sub>		
<b>処理方法</b>		360°C×72h		400℃×72h		
結晶相1						
枯晶相2					<u> </u>	
結晶相3	<u> </u>					
, ,	結晶相1		<u>-</u>			
(容量%)	結晶相2					
結晶相3			<u>-</u>			
水溶出試 (×10 <sup>-7</sup>	g/cm <sup>2</sup> ·h)		17.5		9.9	
抗折強度	(MPa)	2	70		60	
算術平均精	且さRa(Å)		5. O		6. 5	

【0027】第4表の結果から、本発明の磁気ディスク 基板用ガラス組成物と異なる組成のガラス組成物を用い た比較例1~3においては、ガラスの溶融が不可能であ ったり、あるいは、磁気ディスク基板の作製が可能であ っても、熱処理によって結晶化させた後も水溶出試験に おける重量減少を十分に小さくすることができず、ま た、イオン交換によって水溶出試験における重量減少の 小さい磁気ディスク基板とすることができない。また、 比較例4の磁気ディスク基板用ガラス組成物は、本発明 の組成物の組成範囲内にはあるが、理論的光学的塩基性 40 レーションによる磁気膜特性の劣化の少ない磁気ディス 度が大きいために、イオン交換強化した磁気ディスク基 板は、水溶出試験における重量減少が大きい。

#### \* [0028]

【発明の効果】本発明のガラス組成物は、容易に成形す ることができ、研磨加工後ガラス表面層のアルカリ金属 イオンをイオン半径がより大きいアルカリ金属イオンで イオン交換し、ガラスを化学強化することにより、ある いは、熱処理によって主結晶相をLi,O・2SiO,及 び/又はスポジュメンとして結晶化したのち、研磨加工 することにより、優れた化学的耐久性、機械的強度、表 面平滑性、表面平坦性、耐熱性を有し、アルカリマイグ ク基板とすることができる。

フロントページの続き

#### (72)発明者 栗山 育夫

兵庫県西宮市浜松原町2番21号 山村硝子 株式会社内

#### (72)発明者 若林 肇

兵庫県西宮市浜松原町2番21号 山村硝子 株式会社内